

Programme workshop de Nanocaractérisation
du mercredi 19 mars matin

Analyse structurale et morphologique

- Rosine Coq-Germanicus (CRISMAT-Université de Caen-Normandie) : Caractérisations électriques à l'échelle nanoscopique par AFM : complémentarité des modes et impacts des paramètres de mesures
- Giancarlo La Penna (CEA-Leti, PFNC) : Advanced Correlative Analysis of Defects in Next-Gen Semiconductor Substrates: from micro to nanoscale

Analyse chimique

- Hervé Montigaud (Saint-Gobain, CNRS) : Etude de la réactivité des couches « bloqueurs » de titane dans les empilements des vitrages fonctionnalisés pour l'isolation thermique renforcée
- Florian Castioni (LPS, CNRS) : Impact of electron beam propagation on high-resolution quantitative chemical analysis of 1 nm-thick GaN/AlGaIn quantum wells

Analyse par méthodes optiques

- Stefano Pirotta (C2N, CNRS) : Cathodoluminescence de nanostructures de semi-conducteurs
- Van-Hoan Le (CEA-Leti, PFNC): Spectroscopie Raman et ses applications pour les micro et nano-technologies

Analyse 3D et traitements numériques

- Antonin Louiset – (Institut Néel, CNRS & CEA-IRIG, PFNC) : Advanced 4D-STEM data processing for high-resolution imaging
- Serge Brosset (CEA-Leti, PFNC) : Electron Tomography Reconstruction from Limited Tilt-Range Acquisition using Deep Image Prior